## ワイヤーグリッド偏光ピンホールを用いた高分解能点回折干渉顕微鏡 High-resolution point-diffraction interference microscope using a wire grid polarization pinhole

大阪府立大学大学院工<sup>1</sup>, <sup>O</sup>(M2)原田 和眞<sup>1</sup>, 水谷 彰夫<sup>1</sup>, 菊田 久雄<sup>1</sup>

# Graduate school of Engineering, Osaka Pref. Univ.<sup>1</sup>, Kazuma Harada<sup>1</sup>, Akio Mizutani<sup>1</sup>, Hisao Kikuta<sup>1</sup>

## E-mail: sv101056@edu.osakafu-u.ac.jp

### 1.はじめに

細胞を非染色で生きたまま透明物体の位相像として 観察する顕微鏡として、デジタルホログラフィック顕 微鏡に関心が高まっている.デジタルホログラフィ ー・システムの多くは参照光と物体光が別光路を通る マッハツェンダー干渉計に基づくため、光学系が複雑 で振動や空気の揺らぎなどの外乱に弱い欠点がある.

外乱に強い共通光路型の干渉計として,点回折干渉 計(PDI)が報告されている. PDI に位相シフト法を導 入して位相像を定量的に得るには,点回折板のピンホ ール(PH)部分を通る参照光(0 次光)と残りの部分を通 る物体光との間に位相差を与える必要があり,Ramírez らは点回折板に液晶空間フィルタを用いることを提案 している<sup>1)</sup>.しかし,液晶セルの厚さの制限から,PH のサイズは数十 µm と大きくなる.PDI を光学顕微鏡 に適用するには,光学系のエアリーディスクと同等の PH が必要になり,液晶で実現することは難しい.

我々は、PH 内部と外部で金属細線の方向を互いに 直交させたワイヤーグリッド 偏光ピンホール (WGPPH)を用いて、PDI を光学顕微鏡に適用させるこ とを提案した<sup>2)</sup>. この際作製した WGPPH は PH 径が エアリーディスク径と同程度の 10 μm であったもの の、素子面積が1 mm 角の小さなモノであり、顕微鏡 対物レンズの NA を制限して高い解像度が得られなか った.

本研究では、PH 径がより小さく(5 µm),素子面積 がより大きい(10 mm 角)WGPPHを作製し、これを PDI 顕微鏡システムに組み込むことで、対物レンズの 本来の分解能に近い解像度をもつ顕微鏡を実現した. また、デジタルホログラフィーの手法を用いて、デフ ォーカスの位相像から、フォーカス像を算出できるこ とも実験により示した.

### 2.WGPPH を用いた高分解能点回折干渉顕微鏡

Fig.1(a), (b)に WGPPH を用いた高分解能点回折干渉 顕微鏡の光学系, WGPPH の PH 周辺の走査型電子顕微 鏡画像を示す.平行光を透明試料に入射し,無限遠焦 点系の顕微鏡対物レンズ MO(×20)とレンズ L<sub>1</sub>により, L<sub>1</sub>の後ろ焦点位置に試料拡大像がつくられる.レンズ L<sub>2</sub>の焦点位置に WGPPH を配置する.

WGPPH は電子線描画,反応性イオンエッチング, アルミニウムの真空蒸着により作製した. PH 径はレ ンズ  $L_2$ でのエアリーディスク径(4.4  $\mu$ m)とほぼ等しい 5.0  $\mu$ m であり,素子面積は対物レンズ (NA0.4)の有 効径 7.9 mm より大きい 10 mm 角である.



Fig.1 Optical system of the high-resolution point-diffraction interference microscope using a wire grid polarization pinhole: (a) optical system, (b) a magnified view of the central part of the 10×10 mm<sup>2</sup> WGPPH レンズ L<sub>3</sub> でイメージセンサ上に物体像が形成され るが, 偏光板 P<sub>2</sub>によって物体光と参照光が干渉した強 度画像が得られる. 偏光位相シフターによって物体光 と参照光の間に 0°, 90°, 180°, 270°の位相差を付けたと きの強度画像 I<sub>0</sub>, I<sub>90</sub>, I<sub>180</sub>, I<sub>270</sub>から、試料の位相分布と強 度分布が算出できる.

このシステムでは, 試料が対物レンズに対してデフ オーカス位置にあっても, 得られた複素振幅分布から フォーカス位置での複素振幅を計算で求められる.

### 3.微小位相物体の観察

ガラス基板上に約 200 nm (0.17π rad)の段差をもつ直 径 10 μm の丸,一辺 10 μm と 20 μm の四角の透明試料 を観察した. Fig.2 に観察された位相像及び位相分布の 断面を示す. Fig.2(b)から透明試料の段差を算出できて いることがわかる. 横方向分解能を Fig.2(b)に示すよう に 10 μm 角パターンの段差 0.17π rad に相当する側壁部 分より求めると,本顕微鏡は約 1.7 μm の横方向分解能 をもつ. この値は MO(×20)のもつ理論分解能約 1.0 μm と同程度である.



position Fig.2 Measurement results of 10 and 20 μm-size phase objects: (a) phase distribution, (b) Cross section (A-A') of the phase distribution

Fig.3 は試料を対物レンズの焦点位置から 0.5mm ず れたデフォーカス位置に配置した場合に算出された位 相分布とその断面である.平面波展開法によって,フ ォーカス位置で位相分布とその断面を計算で求めた結 果を Fig.4 に示す.デフォーカスされた像からデジタ ルフォーカスによって鮮明なエッジをもつ位相像が得 られていることがわかる.



Fig.4 Measurement results of digital-focused 10 and 20 µm-size phase objects: (a) phase distribution, (b) Cross section (C-C') of the phase distribution 参考文献

- Claudio Ramírez et al., "Point diffraction interferometer with a liquid crystal monopixel", 8116-8125, Vol. 21, No. 7 OPTICS EXPRESS(2013)
- 2)野上教ら, "ワイヤーグリッド型偏光ピンホールを用いた点回折干渉顕微 鏡", 14pP11, OPJ (2013)